

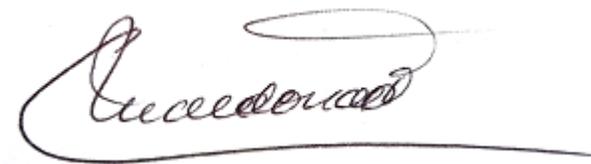
Certificamos que el trabajo

Caracterización morfológica de películas nanoestructuradas de TiO₂ mediante microscopia electrónica de barrido y microscopia confocal 3D

de los autores **Martín Ignacio Broens, Wilkendry Ramos Cervantes, Omar Linarez Pérez, Manuel López Teijelo**, fue presentado en el 5° Congreso Argentino de Microscopía SAMIC, entre los días 16 y 17 de Mayo de 2018.
La Falda - Córdoba - Argentina.



Por Comité Organizador:
Dr. Alberto Riveros



Por Comité Organizador:
Dra. Cristina Maldonado